



2017年度 日本表面科学会 表面分析研究部会セミナー

XPS スペクトルのデータ処理をどう理解するか？

日時 2017年10月27日（金曜日）13:00 – 17:00

場所 東京大学理学部化学本館 5階講堂（機械振興会館から変更しました）
〒113-8654 東京都文京区本郷 7-3-1

<https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/map/map07.html>

主催 表面科学会表面分析研究部会

共催 大学連携研究設備ネットワーク事業、表面分析研究会、
物質・材料研究機構表面化学分析グループ、
ナノテクノロジープラットフォームセンター

セミナーの主旨 XPS による材料表面計測は広く実用的に用いられている。しかし、そのデータ解析・解釈は必ずしも容易ではない。また、その標準化も十分になされていないとは言い難い。実際の現場では、個々の材料、操作ごとに考える必要があり、悩ましい問題を常に含む。そこで、本セミナーでは XPS のピーク分離などの基本的な事柄（易しいわけではない！）から電子輸送シミュレータを駆使した解析例までを、実用を志向した観点から紹介し、参加者と議論したい。分かることは「より明快」に、分からないことは「なぜ分からないか」が納得できるセミナーとしたい。実用分析（Practical Surface Analysis）の難しさがどこにあるのかを明確にすることを意図している。そこで、XPS ユーザーの現場での疑問を取り上げ、講演者と参加者でその情報を共有し、その原因（と可能であれば解決策）を考える場としたい。

講演題目（仮題、講演者は交渉中）

13:00 - 13:40 XPS の基礎

1) XPS の分析・観測深さと標準化

田沼繁夫 (NIMS)

2) XPS 装置の現状

岩井秀夫 (NIMS)

13:40 - 14:40 XPS データ処理の実際

3) COMPRO を用いたデータ処理

– 実用的な解析法をどう選択するか –

吉原一紘(シエンタオミクロン)

4) Tougaard のナノ構造解析を用いたデータ処理

– バックグラウンドとスペクトル形状から見えてくるもの –

眞田則明(アルバックファイ)

14:40 - 15:00 休憩

15:00 - 16:20 表面定量、シミュレータと標準化

5) XPS 分析における表面定量分析と電子輸送シミュレータの役割

- 表面定量を基礎から考える -

吉川英樹(NIMS)

6) 電子輸送シミュレータ SESSA を用いた XPS 分析例

三浦薫(NIMS)

7) XPS データ処理の標準化の現状

- 現場で有効に活かすには -

永富隆清(旭化成)

16:20 - 17:00 Q&A コーナー：計測法からデータの解析・解釈まで

8) Q&A：分析相談コーナー 参加者全員

SP: 5分 x 3件 (目安として; max 5件)

例：このデータはどう解釈すべきか？

：分析・解析のレシピはどう作る？

など、聴衆からの質問に対して皆で考える「分析相談コーナー」

セミナー参加費 無料

参加申し込み締め切り 2017年10月20日(金)

申込・問合せ先

1) 丸林 敬子 MARUBAYASHI.Keiko@nims.go.jp

物質・材料研究機構 統合型材料開発・情報基盤部門

材料データプラットフォームセンター データ収集グループ

〒305-0047 茨城県つくば市千現 1-2-1

Q&Aに関する申し込み/問い合わせは、下記までお願い致します。

2) 田沼 繁夫 Tanuma.shigeo@nims.go.jp

物質・材料研究機構 ナノテクノロジープラットフォームセンター

〒305-0047 つくば市千現 1-2-1

TEL: [029-860-4801](tel:029-860-4801)